มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2553

ข้อสอบวิชา ENE 210 Electronic Devices & Circuit Design I	นศ.วศ.อิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 2
สอบวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553	เวลา 13:00-16:00 น

ชื่อสกุลเลขที่นั่งสอบ

ข้อปฏิบัติในการทำข้อสอบ

- 1 ข้อสอบมีทั้งหมด 5 ข้อ ให้ทำทุกข้อ โดยตอบลงในข้อสอบ
- 2 เขียนตอบให้ชัดเจน อ่านได้โดยง่าย ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษาเอง
- 3 ห้ามนำเอกสารใดเข้าห้องสอบ
- 4 อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ
- 5 หากพบว่าข้อสอบผิดพลาดหรือมีข้อมูลไม่เพียงพอ ให้นักศึกษาตัดสินใจด้วยตนเองและแจ้ง การแก้ไขพร้อมแสดงเหตุผลมาด้วย

<u>คำเตือน</u>

- 1 ให้นักศึกษาระมัดระวังเพื่อป้องกันการทำทุจริตในการสอบ ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจเช่น อาจมีสูตรหรือข้อความใดปรากฏอยู่ในเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาต้องตรวจตรา ให้เรียบร้อยก่อน และจะต้องไม่ทำทุจริตในการสอบโดยเด็ดขาด เพราะนักศึกษาควรมีความ ละอาย และอาจได้รับโทษถึงขั้นหมดสภาพการเป็นนักศึกษาได้
- 2 ให้ระวังการนำข้อสอบออกนอกห้องสอบโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่ตรวจให้คะแนน

อาจารย์ยุทธศักดิ์ รุ่งเรืองพลางกูร ผู้ออกข้อสอบ

ข้อสอบนี้ได้ผ่านการประเมินจากภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯแล้ว

ผศ.ดร. วุฒิชัย อัศวินชัยโชติ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ

ชื่อ-สกุล	รหัส	เลขที่นั่งสอบ
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

ข้อ 1 ก) จากคำกล่าวที่ว่าคาปาซิเตอร์ยินยอมให้กระแสสลับไหลผ่านได้ ทั้งที่โดยโครงสร้างมี dielectric ซึ่งมีสภาพเป็นฉนวนไฟฟ้าขวางกั้นอยู่ นักศึกษาเห็นด้วยหรือไม่ จงอธิบาย (5 คะแนน)

ข) จงออกแบบวงจรแบ่งแรงดันจากแบตเตอรี่ 9 V ให้ได้แรงดันขาออก 5 V ที่กระแสโหลด 0 – 50 μA โดยให้คำนึงถึงอายุใช้งานของแบตเตอรี่ด้วย (8 คะแนน)

	การหาค่า reactance ของ L และ C จะพิจารณาจากรูปคลื่นที่นอกเหนือจาก sinusoidal
	เช่น รูปคลื่นสี่เหลี่ยม หรือสามเหลี่ยม เป็นต้น จะได้หรือไม่ อย่างไรจงอธิบาย (5 คะแนน)
v	i onisi wonisi
ข้อ 2 ก)	ค่าความนำไฟฟ้าของตัวนำไฟฟ้า (conductor) และสารกึ่งตัวนำ (semiconductor) ที่
	เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิ มีความแตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย (5 คะแนน)
	d
11)	จงเขียนและอธิบายโครงสร้างอะตอมอย่างง่ายของสารกึ่งตัวนำซิลิกอนพร้อมแสดงพันธะ
	ระหว่างอะตอมด้วย โดยพิจารณาที่ 0 Kelvin และจงแสดงการเกิด thermal ionization มา

ด้วย (10 คะแนน)

4			ط ی
ប្រក-១៤	្តាត	รหล	เลขทนงสอบ

ข้อ 3 ก) การพิจารณาหาค่าความหนาแน่นของอิเล็กตรอน ในสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น ที่มีรูปทรงคงรูป เป็นรูปทรงกระบอก ที่รู้ขนาดพื้นที่หน้าตัดและความยาว และรู้ค่าความคล่องตัวของ อิเล็กตรอนและโฮล แต่ไม่รู้ค่า N_D จะมีวิธีการทดลองอย่างไร จงอธิบาย (15 คะแนน)

ข) การโด๊ปสารกึ่งตัวนำทำได้อย่างไรและมีวัตถุประสงค์ใด จงอธิบาย (5 คะแนน)

d	•	a -
ชื่อ-สกุล	รห์ส	เลขทนิงสอบ

ข้อ 4 ทันทีที่รอยต่อพี-เอ็นเกิดขึ้น มีปรากฏการณ์ใดเกิดขึ้นที่รอยต่อ ต่อหลังจากนั้น จงอธิบาย พร้อมทั้งเขียนรูปประกอบการอธิบาย (15 คะแนน)

ชื่อ-สก	ງຄ	รหัส	เลขที่นั่งสอบ	
# L 6111	•1	9 % 61		• • • • • •

ข้อ 5 ก) จงแสดงและอธิบาย VI characteristic ของไดโอดสารกึ่งตัวนำ ทั้งในขณะ forward biased และ reverse biased พร้อมทั้งแสดง diode models ด้วย (10 คะแนน)

ข) ปรากฏการณ์เบรคดาวน์ในรอยต่อพี-เอ็น เกิดขึ้นได้อย่างไร และมีโอกาสเกิดในขณะ forward biased หรือไม่ อย่างไร จงอธิบาย (6 คะแนน)